(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-323089 √

(43)公開日 平成11年(1999)11月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
COSL 63/00		C 0 8 L 63/00 B
C 0 8 G 59/62		C 0 8 G 59/62
C08L 83/04		C 0 8 L 83/04
H01L 23/29		H 0 1 L 23/30 R
23/31		
		審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 11 頁
(21)出願番号	特顧平10-152071	(71) 出願人 000002060
		信越化学工業株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月15日	東京都千代田区大手町二丁目6番1号
		(72) 発明者 長田 将一
		群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
		信越化学工業株式会社シリコーン電子材料
		技術研究所内
		(72)発明者 富吉 和俊
		群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
		信越化学工業株式会社シリコーン電子材料
		技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 小島 隆司 (外1名)
•		最終頁に統

(54) 【発明の名称】 半導体封止用エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57)【要約】 (修正有)

【解決手段】 (A) 式 (1) のエポキシ樹脂、(B) 式 (2) のフェノール樹脂硬化剤、(C) 平均組成式 R 3 a R 4 b S i (O R 5) c (O H) d O (4-a-b-c-d)/2 (R 3 はフェニル基、 R 4 は H または C $_1$ ~ C $_6$ の一価炭化水素 基、 R 5 は C $_1$ ~ C $_4$ の一価炭化水素基であり、 0 . 5 \le

 $a \le 2$ 、 $0 \le b \le 1$ 、0. $42 \le c \le 2$. 5、 $0 \le d \le 0$. 35、 $n \ge 0$. $92 \le a + b + c + d \le 2$. 8) で表されるフェニル基及びオルガノオキシ基含有オルガノシロキサン、 (D) 無機充填剤を含有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

$$OCH_{2}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{3}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{4}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{4}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{4}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{4}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{5}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{6}CH-CH_{2}$$

$$OCH_{6}CH-CH_{6}$$

$$OCH_{6}CH-C$$

 $(R^1, R^2 \text{dH}, C_1 \sim C_4 \text{のアルキル基及びフェニル }$ 基、 $n, m = 0 \sim 10$ 。)

【効果】 成形性が良好で、耐リフロークラック性及び

耐湿性に優れ、高い難燃性を有する硬化物を与え、しか もハロゲン化エポキシ樹脂、三酸化アンチモンを含有し ないので、人体・環境に対する悪影響もない。 1

【特許請求の範囲】

(A) 下記一般式(1) で表されるエポ 【請求項1】

キシ樹脂

【化2】

【化1】

(1)

(但し、式中の R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキ ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる 10 原子又は基であり、n=0~10である。)

(B) 下記一般式(2) で表されるフェノール樹脂硬化

(2)

(但し、式中の R^2 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキ ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる 原子又は基であり、m=0~10である。)

 $R_{a}^{3}R_{b}^{4}S i (OR^{5})_{c} (OH)_{d}O_{(4-a-b-c-d)/2}$

(但し、式中の R^3 はフェニル基、 R^4 は炭素数 $1\sim6$ の 一価炭化水素基及び水素原子から選ばれる基、R⁵は炭 素数1~4の一価炭化水素基であり、a, b, c, dは 2. 5、 $0 \le d \le 0$. 35、かつ0. $92 \le a + b + c$ +d≦2.8の範囲の数である。)

(D) 無機充填剤

を含有してなることを特徴とする半導体封止用エポキシ 樹脂組成物。

(但し、式中のR⁶は前記R³又はR⁴と同様の一価炭化 水素基又は水素原子、Xは-OH、-OR⁵(R⁵は前記 と同様) 又はシロキサン残基であり、かつ1つのSi原 子に結合している3つのXのうち少なくとも1つはシロ キサン残基である。)

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1項記載の半 導体封止用エポキシ樹脂組成物の硬化物で封止された半 導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、成形性、高温放置 特性及び耐リフロークラック性に優れ、しかも難燃性に 優れた硬化物を与える半導体封止用エポキシ樹脂組成物 及び該樹脂組成物の硬化物で封止された半導体装置に関 する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】現在、 半導体デバイスは、樹脂封止型のダイオード、トランジ スター、IC、LSI、超LSIが主流となっており、 一般にエポキシ樹脂が他の熱硬化性樹脂に比べ成形性、

(C) 下記平均組成式(3) で表されるフェニル基及び オルガノオキシ基含有オルガノシロキサン

(3)

(C) 成分のフェニル基及びオルガノオ 【請求項2】 キシ基含有オルガノシロキサンの平均重合度が2.5~ 100である請求項1記載の半導体封止用エポキシ樹脂 組成物。

【請求項3】 (C) 成分のフェニル基及びオルガノオ キシ基含有オルガノシロキサンが、分子中に下記一般式 (4) で表される三官能性シロキサン単位を50モル% 以上含有するものである請求項1又は2記載の半導体封 止用エポキシ樹脂組成物。

(4)

接着性、電気特性、機械特性、耐湿性等に優れているた め、エポキシ樹脂組成物で半導体装置を封止することが 多く行われている。

【0003】近年、このエポキシ樹脂組成物中には、難 燃性規格であるUL-94のV-0を達成するために、 一般にハロゲン化エポキシ樹脂と三酸化アンチモンとが 配合されている。このハロゲン化エポキシ樹脂と三酸化 アンチモンとの組み合わせは、気相においてラジカルト ラップ、空気遮断効果が大きく、その結果、高い難燃効 40 果が得られるものである。

【0004】しかしながら、ハロゲン化エポキシ樹脂は 燃焼時に有毒ガスを発生するという問題があり、また、 三酸化アンチモンにも粉体毒性があるため、人体・環境 に対する影響を考慮すると、これらの難燃剤は樹脂組成 物成分として好適とは言い難いものであり、全く含まな いことが望ましい。

【0005】そこで、このような要求に対して、ハロゲ ン化エポキシ樹脂或いは三酸化アンチモンの代替とし て、従来からAl (OH) 3、Mg (OH) 2等の水酸化 50 物、リン系難燃剤等を使用することの検討がなされてき

ている。しかし、いずれの化合物を使用しても、成形時 の硬化性が悪くなったり、耐湿性が悪くなる等の問題点 があり、実用化には至っていないのが現状である。

【0006】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、 成形性、高温放置特性及び耐リフロークラック性に優 れ、しかも難燃性に優れた安全性の高い硬化物を与える 半導体封止用エポキシ樹脂組成物及びその硬化物で封止 された半導体装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結 果、エポキシ樹脂として下記一般式(1)で表されるエ

ポキシ樹脂、その硬化剤として下記一般式 (2) で表さ れるフェノール樹脂、無機充填剤を必須成分として含有 してなる半導体封止用エポキシ樹脂組成物に、難燃剤と して下記一般式(3)で示されるフェニル基及びオルガ ノオキシ基含有オルガノシロキサンを配合することによ り、成形性が良好で、耐リフロークラック性及び耐湿性 に優れる上、高い難燃性を有し、安全性にも優れた硬化 物を与え、この硬化物で封止された半導体装置は、高い 信頼性を有することを見出した。

[0008] 【化3】

(1)

(但し、式中の R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキ [0009] ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる 20 【化4】 原子又は基であり、n=0~10である。)

OH OH
$$CH_2$$
 CH_2 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_5 CH_6 CH_8 C

(2)

原子又は基であり、m=0~10である。)

(但し、式中のR²は水素原子、炭素数1~4のアルキ ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる

 $R_{a}^{3}R_{b}^{4}Si (OR^{5})_{c} (OH)_{d}O_{(4-a-b-c-d)/2}$ (3)

一価炭化水素基及び水素原子から選ばれる基、R⁵は炭 素数1~4の一価炭化水素基であり、a, b, c, dは $\forall \lambda \in A$ 2. 5、 $0 \le d \le 0$. 35、かつ0. $92 \le a+b+c$ +d≦2.8の範囲の数である。)

【0010】この場合、本発明の半導体封止用エポキシ 樹脂組成物は、上記式(1)のエポキシ樹脂と、上記式 (2) のフェノール樹脂硬化剤と、上記式 (3) のフェ ニル基及びオルガノオキシ基含有オルガノシロキサンと を組み合わせて配合したことにより、燃焼時に上記式

(3) のオルガノシロキサン分子中のオルガノオキシ基 の酸化分解架橋により、このオルガノシロキサンと上記 式(1)の芳香環を含むエポキシ樹脂とが結合して燃焼 部周辺に固定され、更に、上記式(3)のオルガノシロ キサン分子中に高含有率で含まれるフェニル基と上記式

(1) の芳香環を含むエポキシ樹脂との間で各々が持つ 芳香環相互のカップリングにより不燃性のSi-Cセラ ミック層が容易に形成され、高い難燃性が発揮されるも のである。それ故、本発明組成物は、ハロゲン化樹脂を 用いなくとも十分な難燃性を得ることができ、しかも、

- (但し、式中の R^3 はフェニル基、 R^4 は炭素数 $1\sim 6$ の 30 三酸化アンチモンのような粉体毒性の問題もなく、成形 性が良好で、耐湿性等の特性に優れ、しかも高い難燃性 を発揮し得る硬化物を与えることを知見し、本発明をな すに至ったものである。

【0011】従って、本発明は、

- (A) 上記一般式(1) で表されるエポキシ樹脂
- (B) 上記一般式 (2) で表されるフェノール樹脂硬化
- (C) 上記平均組成式(3) で表されるフェニル基及び オルガノオキシ基含有オルガノシロキサン
- (D) 無機充填剤

を含有してなることを特徴とする半導体封止用エポキシ 樹脂組成物、及びこの半導体封止用エポキシ樹脂組成物 で封止された半導体装置を提供する。

【0012】以下、本発明について更に詳しく説明する と、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物におい て、(A)成分の下記一般式(1)で表されるエポキシ 樹脂及び(B)成分の下記一般式(2)で表されるフェ ノール樹脂硬化剤は、それぞれビフェニル骨格及びフェ ノール骨格を有する樹脂である。これらの樹脂は、低吸 50 水性かつ優れた靭性を有し、優れた耐リフロークラック

ദ

性を示す硬化物を与え、また、熱分解開始温度が高く、 熱分解速度が遅いため、耐熱性に優れた材料である。

5

【0013】(A)成分は、下記一般式(1)で表される、ビフェニル骨格を含有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂(即ち、ビフェニルアラルキル骨格を有す

るエポキシ樹脂) であり、具体的には、以下のようなも のが挙げられる。

[0014]

【化5】

(1)

(但し、式中R¹は水素原子、炭素数1~4のメチル 基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、 t-ブチル基といったアルキ ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる 原子又は基であり、 $n=0\sim10$ 、好ましくは $0\sim2$ である。)

[0015]

【化6】

(1-4)

 $(n = 0 \sim 10$ 、好ましくは $0 \sim 2$ である。)

【0016】上記式(1)で表されるエポキシ樹脂は、150℃においてICI粘度計(コーンプレート型)により測定される樹脂溶融粘度が0.1~2.5ポイズ、特に0.1~0.8ポイズであることが望ましい。樹脂溶融粘度が2.5ポイズを超えると、耐リフロークラック性向上のため無機充填剤量を80~90重量%と高充

填にする場合、溶融時の流動性が著しく低下してしまう場合があり、0.1ポイズ未満では成形時に内部ボイドが発生し易くなり、信頼性が低下する場合がある。

【0017】本発明では、エポキシ樹脂として、必要に 応じて他のエポキシ樹脂を併用することができる。併用 する他のエポキシ樹脂としては、フェノールノボラック 50 型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂

等のノボラック型エポキシ樹脂、トリフェノールメタン 型エポキシ樹脂、トリフェノールプロパン型エポキシ樹 脂等のトリフェノールアルカン型エポキシ樹脂、ビフェ ニル型エポキシ樹脂、ビフェニル骨格を含有しないフェ ノールアラルキル型エポキシ樹脂、複素環型エポキシ樹 脂、ナフタレン環含有エポキシ樹脂、ビスフェノールA 型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂等の ビスフェノール型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ 樹脂等が挙げられ、これらのうち1種又は2種以上を使 用することができる。また、これらの中では溶融時に低 粘度であるビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノール A型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、 スチルベン型エポキシ樹脂等が好ましい。

【0018】式(1)で表されるエポキシ樹脂の配合量

は、エポキシ樹脂総量(式(1)で表されるエポキシ樹 脂+他のエポキシ樹脂)に対して50~100重量%、 特に70~100重量%であることが望ましい。式 (1) のエポキシ樹脂の配合量が50重量%未満では、

十分な耐リフロークラック性、難燃性が得られない場合 がある。

【0019】また、(B)成分は、下記一般式(2)で 表される、ビフェニル骨格を含有するアラルキル型フェ ノール樹脂(即ち、ビフェニルアラルキル骨格を有する フェノール樹脂) 硬化剤であり、具体的には下記のもの を挙げることができる。

[0020] 【化7】

OH OH OH
$$CH_{2} \longrightarrow CH_{2} \longrightarrow C$$

(5)

(2)

(但し、式中R²は水素原子、炭素数1~4のメチル 基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、 t -ブチル基といったアルキ ル基及びフェニル基から選択される同一もしくは異なる

20 原子又は基であり、m=0~10、好ましくは0~2で ある。)

[0021]

(2-1)

$$H_{a}C$$
 OH CH_{2} OH CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{3} CH_{4} CH_{2} CH_{2} CH_{2} CH_{3} CH_{4} CH_{2} CH_{2} CH_{3}

$$\begin{array}{c} OH \\ CH_{s} \\ CH_{2} \\ \hline \\ CH_{2} \\ \hline \\ CH_{2} \\ \hline \\ CH_{3} \\ \hline \\ CH_{4} \\ \hline \\ CH_{5} \\ CH_{5} \\ \hline \\ CH_{5} \\ C$$

$$\begin{array}{c} OH \\ CH_{a}C \\ CH_{a} \\ CH_{a}C \\ CH_{a} \\ \end{array} \begin{array}{c} OH \\ CH_{a} \\ CH_{a} \\ CH_{a} \\ \end{array} \begin{array}{c} OH \\ CH_{a} \\ CH_{a} \\ \end{array} \begin{array}{c} OH \\ CH_{a} \\ CH_{a} \\ \end{array} \begin{array}{c} OH \\ CH_{a} \\ CH_{a} \\ \end{array}$$

(2-4)

(m=0~1~0、好ましくは0~2である。)

【0022】本発明において、(B)成分の式(2)で 表されるフェノール樹脂硬化剤は、150℃においてⅠ CI粘度計(コーンプレート型)により測定される樹脂 50 【0023】本発明では、必要に応じて、硬化剤として

溶融粘度が 0. 1~1. 2ポイズ、特に 0. 2~0. 8 ポイズであることが望ましい。これはエポキシ樹脂と同 様の理由によるものである。

10

20

他の硬化剤を併用することができる。併用する硬化剤と しては、例えばフェノールノボラック樹脂、クレゾール ノボラック樹脂等のノボラック型フェノール樹脂、ナフ タレン環含有フェノール樹脂、ビフェニル骨格を含有し ないフェノールアラルキル型フェノール樹脂、ビフェニ ル型フェノール樹脂、トリフェノールメタン型フェノー ル樹脂、トリフェノールプロパン型フェノール樹脂等の トリフェノールアルカン型フェノール樹脂、脂環式フェ ノール樹脂、複素環型フェノール樹脂、ビスフェノール A型フェノール樹脂、ビスフェノールF型フェノール樹 脂等のビスフェノール型フェノール樹脂等が挙げられ、 これらのうちの1種又は2種以上を使用することができ

9

【0024】式(2)で表されるフェノール樹脂硬化剤 の配合量は、フェノール樹脂硬化剤総量(式(2)で表

(但し、式中の R^3 はフェニル基、 R^4 は炭素数 $1 \sim 6$ の 一価炭化水素基及び水素原子から選ばれる基、R⁵は炭 素数1~4の一価炭化水素基であり、a, b, c, dは それぞれ $0.5 \le a \le 2$ 、 $0 \le b \le 1$ 、 $0.42 \le c \le$ 2. 5、 $0 \le d \le 0$. 35、かつ0. $92 \le a + b + c$ +d≦2.8の範囲の数である。)

【0028】上記式 (3) 中、R³はフェニル基、R⁴は 炭素数1~6の一価炭化水素基及び水素原子であり、例 えば一価炭化水素基としては、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数2~6のアルケニル基が好ましい。具体的に は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペ ンチル基、シクロヘキシル基、ヘキシル基等のアルキル 基、ビニル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニ ル基、ブテニル基、イソブテニル基、ヘキセニル基など のアルケニル基が挙げられる。R⁴としては、特にメチ ル基、ビニル基が立体障害緩和の点からも工業的にも好 ましい。

【0029】更に、R⁵は炭素数1~4のアルキル基、 アルケニル基等の一価炭化水素基であり、前記したR4 の一価炭化水素基として例示したもののうち炭素数1~ 4のものと同じものを挙げることができるが、好ましく は炭素数1~4のアルキル基であり、例えばメチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イ ソブチル基、tert-ブチル基等である。なお、R⁵ が炭素数5以上のアルキル基であると、アルコキシ基と しての反応性が低く難燃化効果が期待できない。

【0030】本発明組成物は、上記したように燃焼時に 上記式(3)のオルガノシロキサン分子中のアルコキシ 基等のオルガノオキシ基(OR⁵)の酸化分解架橋によ り、このオルガノシロキサンと上記式(1)の芳香環を 含むエポキシ樹脂とが結合して燃焼部周辺に固定され、 更に、上記式 (3) のオルガノシロキサン分子中に髙含 有率で含まれるフェニル基と上記式 (1) の芳香環を含 50 果と直接関係がないため、含有量が多くなれば逆効果と

されるフェノール樹脂硬化剤+他のフェノール樹脂硬化 剤) に対して50~100重量%、特に70~100重 量%であることが望ましい。式(2)のフェノール樹脂 硬化剤の配合量が50重量%未満では、十分な耐リフロ ークラック性、難燃性が得られない場合がある。

【0025】本発明において、(A)成分のエポキシ樹 脂、(B)成分の硬化剤の配合量は特に制限されない が、(A)成分のエポキシ樹脂中に含まれるエポキシ基 1モルに対して、(B)成分の硬化剤中に含まれるフェ ノール性水酸基のモル比が 0.5~1.5、特に 0.8 ~1. 2となる範囲が好ましい。

【0026】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物 は、難燃剤として (C) 成分の下記平均組成式 (3) で 示されるオルガノシロキサン化合物を配合する。

[0.027]

(3) $R_{a}^{3}R_{b}^{4}S i (OR^{5})_{c} (OH)_{d}O_{(4-a-b-c-d)/2}$

> むエポキシ樹脂との間で各々が持つ芳香環相互のカップ リングにより不燃性のSi-Cセラミック層が容易に形 成され、高い難燃性が発揮されるものである。この難燃 化機構が有効に働くためには、式(3)中のオルガノオ キシ基含有率を示す c 値、即ちS i 原子1モルに対する オルガノオキシ基のモル数が0.42~2.5、好まし くは 0 . 5~2 . 3 モルである必要がある。 c が 0 . 4 2未満では架橋性が低すぎて燃焼部周辺に固定化され難 く、また、2.5を超えると低分子量なオルガノシロキ サンしか得られず、燃焼時に固定化される前に熱で気化 することによる損失率が高くなるため、いずれの場合も 難燃化効果が低下してしまう。

【0031】また、式(3)において、オルガノシロキ 30 サンに含まれるシラノール基(即ち、ケイ素原子に結合 した水酸基) は反応性が低く、難燃性にほとんど寄与す ることはないが、保存安定性の面や加工性の面から、シ ラノール基含有率を示すdの値は0.35以下、好まし くは0~0.2である。

【0032】式(3)において、上述の難燃化機構が有 効に働くために必要なもう一つの要素であるフェニル基 含有率を示す a、即ちSi原子1モルに対するフェニル 基のモル数は0.5~2、好ましくは0.6~1.8で ある必要がある。 a の値が 0. 5未満であるとフェニル 基が少なすぎて難燃化効果が得られず、2を超えるとフ ェニル基含有率は十分に高いが、嵩高いフェニル基が一 つのSi上に密集した構造を多く含むため、立体障害が 大きくオルガノポリシロキサン分子の空間的自由度が低 下し、芳香環相互のカップリングによる難燃化機構が作 用するのに必要な芳香環同士の重なりが困難になり、難 燃化効果が低下してしまう。

【0033】式(3)のオルガノシロキサンは、Si-C結合でSiに結合する置換基としてフェニル基以外の 置換基R⁴を含んでもよい。この置換基R⁴は、難燃化効

なるが、適量含有させることで、嵩高いフェニル基含有 率の高いオルガノシロキサン分子の立体障害を緩和して 空間的な自由度を向上させ、フェニル基同士の重なりを 容易にして難燃化効果を高める方向に働く場合もある。 この効果を期待できるR⁴の含有率、即ちbの値は1以 下、好ましくは式(3)中のa+bに対するbの比率b / (a+b) で0~0.3の範囲である。b/ (a+ R⁶S i X₃

11

(但し、式中のR⁶は前記R³又はR⁴と同様の一価炭化 水素基又は水素原子、Xは-OH、-OR⁵(R⁵は前記 と同様) 又はシロキサン残基であり、かつ1つのSi原 子に結合している3つのXのうち少なくとも1つはシロ キサン残基である。)

【0036】ここで、シロキサン残基とは≡Si−O− 結合において、酸素原子が他のSi原子と結合してシロ キサン結合を形成するものをいう。具体的には、Xの1 つがシロキサン残基の場合、これはO_{1/2}で表わされ、 Xの2つがシロキサン残基の場合はO2/2、Xの3つが シロキサン残基の場合はO3/2で表わされ、これら酸素 原子は他のSi原子と結合してシロキサン結合を形成す る。上記式(4)の単位を具体的に示すと下記の通りで ある。

[0037]

【化9】

 $(R^6$ は上記の通りであり、X'はOH又はOR⁵を示 す。)

【0038】本発明において、上記式(4)の三官能性 シロキサン単位は、三次元的な架橋構造を形成してオル ガノシロキサン分子構造を強固にすることで樹脂的性質 を付与し、エポキシ樹脂組成物への分散性、加工性の向 上に寄与する。また、単官能性や二官能性シロキサン単 位を多く含む直線的な分子構造のオルガノシロキサン は、燃焼時に起きるシロキサン結合の熱による再配列で 揮発性低分子量シロキサンを形成して系外へ逃げ易いの に対し、架橋反応性の高い式 (4) の三官能性シロキサ ン単位を多く含むオルガノシロキサンは、更に高分子量 40 化して系内に止まり難燃化に寄与する。従って、式

(4) の三官能性シロキサン単位は、式(3) のオルガ ノポリシロキサン中に50モル%以上、特に60モル% 以上、とりわけ70~100モル%含有していることが 好ましい。三官能性シロキサン単位の含有率が50モル %未満では、これらの効果が小さくなることがある。

【0039】(C)成分のオルガノシロキサン中には、 上記式 (3) の三官能性シロキサン単位以外の構成単位 として、特性に影響を与えない範囲で二官能性シロキサ ン単位、単官能性シロキサン単位、四官能性シロキサン 50 法も可能である。この場合は、反応を促進する触媒とし

b) が 0. 3を超えると、相対的なフェニル基含有率が 低下して難燃化効果が十分に得られなくなる場合があ

【0034】本発明の(C)成分のオルガノシロキサン は、分子中に下記一般式(4)で表される三官能性シロ キサン単位を含有していることが好ましい。

[0035]

(4)

単位を含有してもよい。特に四官能性シロキサン単位 10 は、三次元的な架僑構造を形成してオルガノシロキサン 分子構造を強固にすることや、高い架僑反応性が高分子 量化を促して系内に止まり難燃化に寄与する。 なお、こ の四官能性シロキサン単位は、含有率が多くなるとエポ キシ樹脂への分散性が低下するので、好ましい含有率は 50モル%以下である。

【0040】また、式(3)のオルガノシロキサンの平 均重合度は2.5~100、特に2.5~50、とりわ け2. 5~20が好適であり、重量平均分子量が410 以上2000未満の範囲となることが望ましい。なお、 20 平均分子量、平均重合度は、GPC (ゲルパーミエーシ ョンクロマトグラフィー)分析による重量平均値(例え ば、ポリスチレン換算)等として求めることができる。 上記平均重合度は難燃化効果を決める重要な因子であ り、上記した平均重合度範囲のオルガノシロキサンは、 溶融混合時によく分散し、燃焼時における熱で溶融して 移動し燃焼部周辺に集まることもできる。また、この動 き易さはフェニル基の重なりを容易にすることでも難燃 化の効果を向上させる。平均重合度が2.5未満の低分 子量オルガノシロキサンでは、燃焼時における熱による 30 気化で難燃化効果が低下してしまう場合があり、100 を超えると燃焼時の動き易さがなくなり難燃化効果が低 下し、またエポキシ樹脂への分散性が悪くなることがあ ろ.

【0041】上記式(3)のオルガノシロキサンは、公 知の方法で製造できる。例えば、上記のシロキサン単位 を形成し得るオルガノクロロシランに、全てのクロル基 と反応するに過剰の量のアルコールと水を反応させてア ルコキシ基含有オルガノシランを形成し、減圧ストリッ プ等の方法で未反応アルコール、水及び反応副生物であ る塩化水素を除去して目的物を得ることができる。な お、アルコキシ基含有率や平均分子量の調整は、反応さ せるアルコールと水の量を調整することにより可能であ る。水は目標の平均分子量が達成される理論量とし、ア ルコールは目標のアルコキシ基量を達成する理論量より 過剰にすれば、目標の構造に近いオルガノシロキサンを 得ることができる。

【0042】上記のシロキサン単位を形成し得るアルコ キシシランが入手できれば、目標の平均分子量が達成で きる理論量の水を加えて部分加水分解縮合反応させる方 て、酸、塩基、有機金属化合物などを添加することが望ましい。副生したアルコールを常圧蒸留や減圧ストリップにより除去することにより、目的物を得ることができる。より保存安定性を高める必要がある場合は、添加した反応触媒を中和等の方法により除去してもよい。いずれの方法においても、ゲルの発生や分子量分布の広がりを抑制する目的で有機溶剤を配合することも可能である。

13

【0043】本発明において、上記式(3)のオルガノシロキサンの添加量は、エポキシ樹脂と硬化剤との総量100重量部に対して0.1~50重量部、特に2~20重量部が好適である。配合量が0.1重量部未満では難燃性を十分に付与することができない場合があり、50重量部を超えると成形時の粘度が高くなり、また成形品の外観や強度に悪影響を与える場合がある。

【0044】本発明のエポキシ樹脂組成物中に配合される無機充填剤としては、通常エポキシ樹脂組成物に配合されるものを使用することができる。無機充填剤としては、例えば溶融シリカ、結晶性シリカ等のシリカ類、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミニウム、ボロンナイトライド、酸化チタン、ガラス繊維等が挙げられる。

【0045】これら無機充填剤の平均粒径や形状は特に限定されないが、成形性及び流動性の面から平均粒径が5~40μmの球状の溶融シリカが特に好ましい。

【0046】なお、無機充填剤は、樹脂と無機充填剤と の結合強度を強くするため、シランカップリング剤、チ タネートカップリング剤などのカップリング剤で予め表 面処理したものを配合することが好ましい。このような カップリング剤としては、例えばγーグリシドキシプロ ピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキシプロピルメ チルジエトキシシラン、β - (3, 4 - エポキシシクロ ヘキシル) エチルトリメトキシシラン等のエポキシ官能 性アルコキシシラン、N-β (アミノエチル) - γ-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、ソーアミノプロピル トリエトキシシラン、N-フェニルーy-アミノプロピ ルトリメトキシシラン等のアミノ官能性アルコキシシラ ン、ャーメルカプトプロピルトリメトキシシラン等のメ ルカプト官能性アルコキシシランなどのシランカップリ ング剤を用いることが好ましい。なお、表面処理に用い るカップリング剤の配合量及び表面処理方法については 特に制限されるものではない。

【0047】無機充填剤の充填量は、エポキシ樹脂と硬化剤の総量100重量部に対して400~1100重量部、特に600~90重量部が好適であり、充填量が400重量部未満では膨張係数が大きくなり、半導体素子に加わる応力が増大し素子特性の劣化を招く場合があり、また組成物全体に対する樹脂量が多くなるために、本発明の目的とする難燃性が得られない場合がある。一方、1100重量部を超えると成形時の粘度が高くなり、成形性が悪くなる場合がある。なお、無機充填剤

は、組成物中 $75\sim92$ 重量%、特に $83\sim90$ 重量% 含有していることが好ましい。

【0048】本発明においては、エポキシ樹脂と硬化剤との硬化反応を促進させるため、硬化促進剤を配合することが好ましい。この硬化促進剤は、硬化反応を促進させるものであれば特に制限はなく、例えばトリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリ(アーメチルフェニル)ホスフィン、トリ(ノニルフェニル)ホスフィン、トリフェニルボラフィン・トリフェニルボラフィン、トリフェニルボラフェニルボラフェニルボラフェニルボンシ、アトラフェニルホスフィン・テトラフェニルボレートなどのリン系化合物、トリエチルアミン、ベンジルジメチルアミン、1,8ージアザビシクロ(5.4.0)ウンデセンー7なの第3級アミン化合物、2ーメチルイミダゾール、2ーフェニルー4ーメチルイミダゾールなどのイミダゾール化合物等を使用することができる。

【0049】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、更に必要に応じて各種の添加剤を配合することができる。添加剤としては、例えば熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー、有機合成ゴム、シリコーン系等の低応力剤、カルナバワックス、高級脂肪酸、合成ワックス等のワックス類、カーボンブラック等の着色剤、ハロゲントラップ剤等の添加剤を添加配合することができる。なお、これらの添加剤の配合量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0050】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、無機充填剤、その他の添加物を所定の組成比で配合し、これをミキサー等によって十分均一に混合した後、熱ロール、ニーダー、エクストルーダー等による溶融混合処理を行い、次いで冷却固化させ、適当な大きさに粉砕して成形材料とすることができる。

【0051】このようにして得られる本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、各種の半導体装置の封止剤に有効に利用でき、この場合、封止の最も一般的な方法としては、低圧トランスファー成形法が挙げられる。なお、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の成形温度は150~180℃で30~180秒、後硬化は15

[0052]

【発明の効果】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、成形性が良好で、耐リフロークラック性及び耐湿性に優れている上、高い難燃性を有する硬化物を与え、しかもハロゲン化エポキシ樹脂、三酸化アンチモンを樹脂組成物中に含有しないので、人体・環境に対する悪影響もない安全性の高いものである。従って、本発明のエポキシ樹脂組成物で封止した半導体装置は、高い信頼性を有する。

50 [0053]

【実施例】以下、調製例、実施例及び比較例を示し、本 発明を具体的に示すが、本発明は下記の実施例に制限さ れるものではない。なお、以下の例において部はいずれ も重量部であり、平均重合度、平均分子量はいずれも重 量平均値である。

【0054】 [調製例1] 撹拌装置、冷却装置、温度計 を取り付けた1 L フラスコにフェニルトリクロロシラン 211g(1モル)とトルエン143gを仕込み、オイ ルバスで内温40℃にまで加熱した。滴下ロートにメタ ノール64g(2モル)を仕込み、フラスコ内へ撹拌し ながら1時間で滴下し、アルコキシ化反応中に発生する 塩化水素ガスを系外へ除去しながら反応を進めた。滴下 終了後、更に内温40℃で撹拌を1時間続けて熟成し た。次に、滴下ロートに水12g(0.7モル)を仕込 み、フラスコ内へ撹拌しながら1時間で滴下し、加水分 解縮合反応中に発生する塩化水素ガスを系外へ除去しな がら、反応を進めた。滴下終了後、更に内温40℃で撹 拌を1時間続けて熟成し、引き続き減圧蒸留によりトル エン、過剰分のメタノール、未反応の水、塩化水素を除 去したところ、液状のメトキシ基含有オルガノシロキサ ン151gが得られた。

【0055】得られたオルガノシロキサンは、下記式 $R^3{}_aR^4{}_bS$ i $(OR^5)_c$ ($OH)_dO_{(4-a-b-c-d)/2}$ で表すとa=1. 0、b=0、b/ (a+b)=0 で i 原子上のS i -C結合で結合した有機置換基は100 モル%がフェニル基であり、c=1. 5、 $R^5=$ メチル基、d=0. 2、三官能性シロキサン単位を100モル%含み、外観は無色透明液体で平均重合度 3(平均分子量は500)であった。

【0056】 [調製例2] 調製例1において、1Lフラスコにフェニルトリクロロシラン159g(0.75モル)とメチルトリクロロシラン37g(0.25モル)とトルエン143gを仕込み、滴下ロートにメタノール48g(1.5モル)を仕込んでアルコキシ化し、引き続き滴下ロートに水18g(1モル)を仕込んで加水分解縮合反応させた以外は調製例1と同様にして、メトキシ基含有液状オルガノシロキサン120gを得た。

【0057】得られたオルガノシロキサンは、下記式 $R^3{}_aR^4{}_bS$ i (OR^5) c (OH) d $O(4{}^-a{}^-b{}^-c{}^-d)/2$ で表すとa=0. 75、b=0. 25、b / (a+b) =0. 25 でS i 原子上のS i -C結合で結合した有機 置換基は75 モル%がフェニル基、25 モル%がメチル基であり、c=1. 0 、 $R^5{}^-$ メチル基、d=0. 1 7 、三官能性シロキサン単位を100 モル%含み、外観は無色透明液体で平均重合度 14 (平均分子量は1900)であった。

【0058】[調製例3] 調製例1において、1Lフラスコにフェニルトリクロロシラン85g(0.4モル)とテトラメトキシシラン91g(0.6モル)とメタノ

ール64gを仕込み、滴下ロートに30%の塩酸水16g(水0.6モル)を仕込んだ以外は調製例1と同様に調製し、メトキシ基含有オルガノシロキサン125gを得た。

16

【0059】得られたオルガノシロキサンは、下記式 $R^3{}_aR^4{}_bSi$ (OR^5) $_c$ (OH) $_dO$ ($_{4-a-b-c-d}$)/ $_2$ で表すと $_a=0$. $_4$ 、 $_b=0$ 、 $_b$ /($_a+_b$)= $_0$ で $_5$ i 原子上の $_5$ i $_-$ C結合で結合した有機置換基は $_1$ 00 モル%がフェニル基であり、 $_c=2$. $_6$ 、 $_8$ $_5=_4$ $_7$ $_8$ 基、 $_4=0$. $_1$ 、三官能性シロキサン単位を $_4$ 0 モル% 含み、外観は無色透明液体で平均重合度 $_2$ (平均分子量は $_3$ 00)であった。

【0060】 [実施例、比較例] 表1に示す成分を熱2 本ロールにて均一に溶融混合し、冷却、粉砕して半導体 封止用エポキシ樹脂組成物を得た。なお、使用した原材 料は、下記の通りである。

・エポキシ樹脂

(イ):式(1-1)で表されるエポキシ樹脂 NC3 000P(日本化薬製、エポキシ当量272、150℃ 20 においてICI粘度計(コーンプレート型)により測定 される樹脂溶融粘度0.8ポイズ)

(ロ):ビフェニル型エポキシ樹脂:YX4000HK (油化シェル製、エポキシ当量190)

(ハ): o - クレゾールノボラック型エポキシ樹脂: EOCN1020-55(日本化薬製、エポキシ当量20O)

・硬化剤

(二):式(2-1)で表されるフェノール樹脂:ME H7851L(明和化成製、フェノール当量199、1 30 50℃においてICI粘度計(コーンプレート型)により測定される樹脂溶融粘度0.8ポイズ)

(ホ):フェノールアラルキル樹脂:MEH7800SS(明和化成製、フェノール当量175)

・難燃剤

調製例1~3で得られたオルガノシロキサン

・無機充填剤

球状溶融シリカ (平均粒径13 μ m)

・硬化促進剤

トリフェニルホスフィン

40 ・離型剤

ハイドロタルサイト類化合物: DHT4A (協和化学工業(株)製)

- ・離型剤:カルナバワックス(日興ファインプロダクツ (株) 製)
- ・シランカップリング剤: KBM403 (信越化学工業 (株) 製)

[0061]

【化10】

n = 0. 74 (平均値)

(1-1)

m=0.44 (平均値)

(2-1)

【0062】これらのエポキシ樹脂組成物につき、下記方法で諸特性を測定した。結果を表1に併記する。

《スパイラルフロー値》EMMI規格に準じた金型を使用して、175℃、70kg/cm²、成形時間120 秒の条件で測定した。

《難燃性》UL-94規格に基づき、1/16インチ厚の板を成形し難燃性を調べた。

《耐湿性》アルミニウム配線を形成した 6×6 mmの大きさのシリコンチップを 14 p i n - D I P フレーム (42 アロイ) に接着し、更にチップ表面のアルミニウム電極とリードフレームとを 30 μ m ϕ の金線でワイヤ

ボンディングした後、これにエポキシ樹脂組成物を成形 条件175℃、70kg/сm²、成形時間120秒で 成形し、180℃で4時間ポストキュアーした。このパ ッケージを140℃/85%RHの雰囲気中5Vの直流 バイアス電圧をかけて500時間放置した後、アルミニ 20 ウム腐食が発生したパッケージ数を調べた。

【0063】表1の結果より、本発明のエポキシ樹脂組成物は、成形性が良好で、耐リフロークラック性及び耐湿性に優れている上、高い難燃性を有する硬化物を与え、しかも、ハロゲン化エポキシ樹脂、三酸化アンチモンを樹脂組成物中に含有しないので、人体・環境に対する悪影響もなく、安全性が高いことが確認された。

[0064]

【表1】

組成(重量部)		実施例						比較例					
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	
エポキシ樹脂 (ロ)		52.83	55.33	47.83	52.83	35.88	57.94	40.48	57.83	52.83	1	57.8 3	
		(ロ)	1	_	-	_	13.95		15.92		-	1	-
		(v)	-	-	-	_	-	_	-	-	_	59.42	-
			37.17	39.67	32.17	37.17	40.17	23.44	24.52	42.17	37.17	1	42.17
フェノール樹	物脂	(4)	_	-	-	_	-	8.62	9.02	-	-	30.48	-
難燃剤 (オルガノ シロキサ ン)	租	類	四製例	調整例 1品	理認 例	調製例 2品	調整例 1品	間製剤	西契例	_	調製例 S高	調製例 1品	_
	配合量		10	5	20	10	10	10	10	_	10	10	_
水酸化アルミニウム		_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	50	
無機充填剤		700	700	700	700	700	700	700	700	700	450	700	
硬化促進剤		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
離型剤		3	3	3	3	3	Э	3	3	3	3	3	
カーボンブラック		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
シランカップ リング剤		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
スパイラルフロー (cm)		90	8 5	90	90	95	90	100	90	90	110	70	
成形便度		75	78	75	75	80	80	83	75	75	85	30	
難燃性		v – c	v – c	v – c	v - 0	v – c	v – c	v – c	v – 1	l V – 1	燃焼	v – 0	
耐湿性		20	°2⁄20	%	0/ 20	% 20	0/ 20	0/ 20	20	0/ 20	0/ 20	20 20	

フロントページの続き

(72)発明者 浅野 英一

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(72)発明者 青木 貴之

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内

(72)発明者 塩原 利夫

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内